

# Capital Products & Review

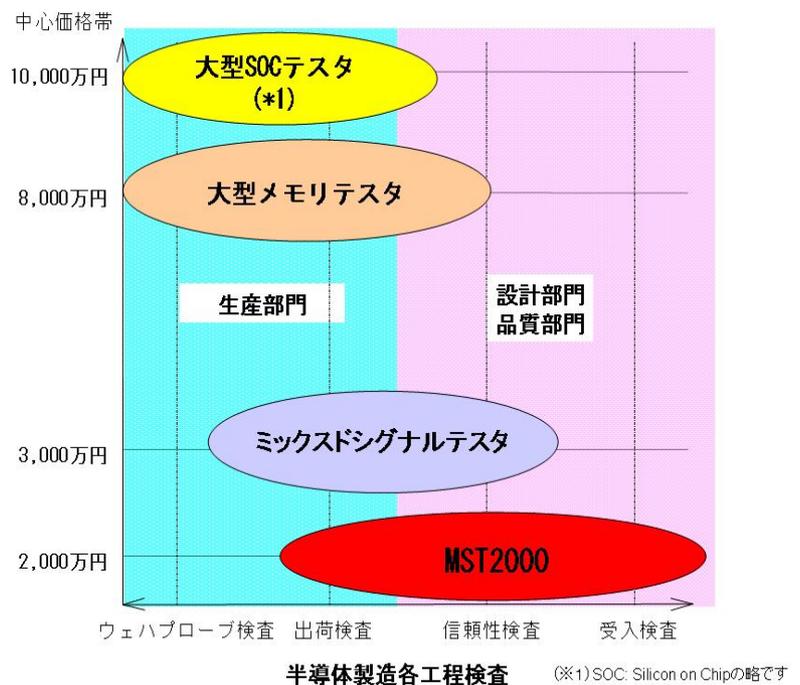
## コスト・ハイパフォーマンス/ベンチトップ LSI テスタ 『MST2000』

株式会社ジェピコ 国立 R&D センター  
<http://www.jepico.co.jp>

**コスト・ハイパフォーマンス/ベンチトップ LSI テスタ 『MST2000』**  
プロダクションテストから、レーザートリミング、QA テスト、デバイスの特性評価、不良解析、あらゆるテストニーズに 100%対応します。

### ■ LSI テスタと MST2000 の特徴

MST2000 LSI テスタは、リニア LSI、デジタル LSI、ミックスド・シグナル LSI など多品種の半導体デバイスに対応したベンチトップ・テスト・システムです。MST2000 は、リニア LSI やミックスド・シグナル LSI のリーディング・サプライヤーであるアナログ・デバイス社が開発した半導体テスタ LTS2020 と 100%上位互換性を備えています。独自のファミリ・ボード・アーキテクチャにより、高コスト・パフォーマンス、高スループットのテストを最小スペースで実現します。特に少量多品種で高信頼性が要求される防衛・宇宙分野の信頼性試験に最適で、検査デバイスに応じて、ファミリ・ボード、ソケット・アセンブリ、DUT ボードを組み換えることで、効率の良いテストパッケージ開発が可能です。



- 低価格、省スペース、オールインワン・テスタ
- デバイスの DC 特性の測定が可能
- 自動システムキャリブレーション。高測定精度  
± (0.0015% ± 100uV)
- 多様なファンクションに対応するファミリ・ボード・アーキテクチャ
- Windows OS に対応し、プルダウン・メニュー方式による簡単操作
- マイクロソフト社 Visual C++によるテスト・プログラム開発環境
- テスト対象デバイス： オペアンプ、レギュレータ 等のリニア LSI、A/D コンバータ、D/A コンバータ、汎用ロジック LSI、ASSP、その他 LSI
- 優れたコスト・パフォーマンス(他社製大型テスタと比較して約 1/5)

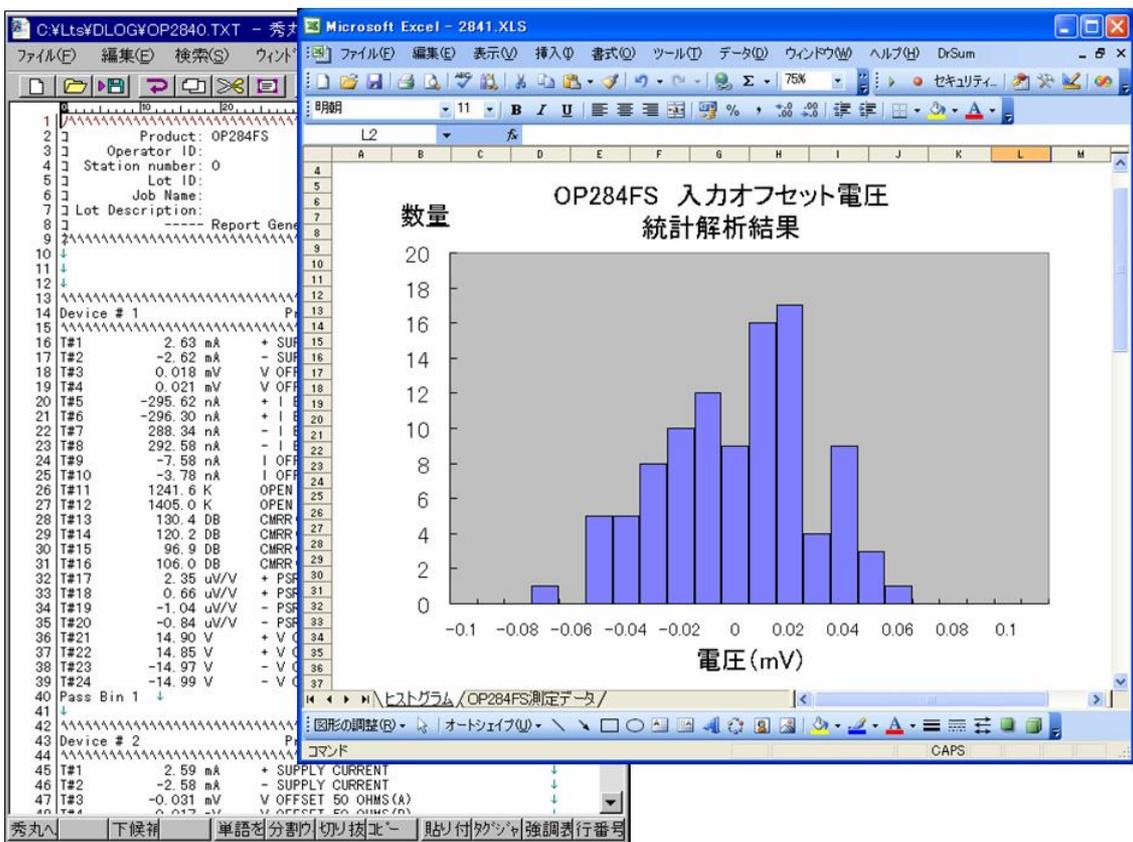
Space Japan Review, No. 44, December 2005 / January 2006

● MST2000 テストシステム性能表

	レンジ	分解能	精度
DC 電圧測定	±10Vmax	16bit	±(0.001+100uV)
高精度 V ソース A	±10V, +10V	16bit	±(0.001+100uV)
クワッド V ソース	0~+20V, 2ch	12bit	±0.25%FS
	-20~0V, 2ch	12bit	±0.25%FS
高精度 V ソース(SR)	-10~+10V	16bit	±0.001%FS
ソース TH(VTH)	0~+10V	8bit	±0.25%FS
デジタルドライバー	チャンネル数	24	
	出力 Tr 特性	VCEmax=30V, ILimit=200mA(VCE (SAT)=0.7V)	
デジタルインプット	チャンネル数	24	
	入カスレッシュホールド	0~+10V	
重量	テストヘッド	約 10Kg	
	パワーヘッド	約 40Kg	
外形寸法	テストヘッド	W498 × D499 × H270	
	パワーヘッド	W498 × D499 × H160	

● データ処理

測定データはテキスト形式で出力・蓄積できるので、EXCEL 等市販のソフトウェアにより統計解析を行うことができます。



■ **フレキシブルなテストングサービス**

当社が宇宙・防衛市場で半導体部品を提供させていただいております長年の経験と、これまで培ってまいりましたお客様との信頼関係に基づき、お客様のご要望にフレキシブルにお応え致します。



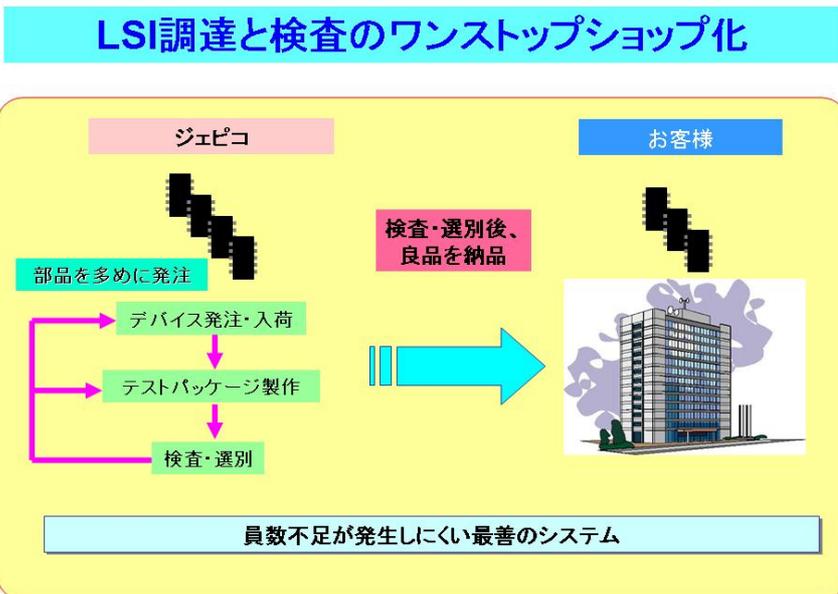
● **テストパッケージ開発業務**

既に LSI テスタ「MST-2000」を導入されているお客様向けに、当社が蓄積している豊富な LSI テスト技術や試験ノウハウを活用し、LSI テストパッケージ開発を代行いたします。お客様のご要求仕様に応じて、テスト回路設計からドキュメント管理まで、また特殊テストパッケージ（温度試験対応テストパッケージその他）対応など、フレキシブルに対応させていただきます。（テストパッケージ開発総数 1000 品種以上）

● **半導体入手&検査:ワンストップショップ**

お客様にとって煩わしい、デバイスの調達からテストパッケージ開発、特性検査、選別作業までを弊社が一括して代行致します。（詳細は右図参照）

- 豊富なサプライヤーから最適条件（納期、数量等）でデバイスを調達
- テスト仕様書の作成、テストパッケージの開発
- デバイスの特性検査・選別、検査証明書の発行



**お問い合わせ先**



株式会社 **ジェピコ** 国立 R&D センター  
 〒 186-0002 東京都国立市東 1-4-1 大和国立ビル  
 TEL 042-580-6855 (直通) FAX 042-580-6851  
 URL : <http://www.jepico.co.jp> e-mail : support-6@jepico.co.jp